

走査電子顕微鏡

【日時】 2019/4/23 (火) 13:00-17:00

【場所】 九州大学伊都キャンパス・稲盛財団記念館1F稲盛ホール

【主催】 九州大学中央分析センター

【共催】 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】 株式会社日立ハイテクノロジーズ・JFEテクノロジー株式会社

13:00-14:30 走査電子顕微鏡で何が観えるか？ －二次電子像と反射電子像の活用－

本講義では、まず走査電子顕微鏡の装置構成を簡単に説明します。次に二次電子と反射電子の特徴を解説し、それらから得られる豊かな情報を実例に基づき紹介します。元素分析と結晶方位解析技術の概要に続き、低加速電圧や複数の像検出器の活用など最新の進歩にも触れます。

14:30-14:40 休憩

14:40-15:20 走査電子顕微鏡の選択と使い分け

最新の走査電子顕微鏡のラインナップを紹介し、その使い分け、アプリケーションについてご説明します。

15:20-16:10 SEMの活用 (1) ライフサイエンス分野

細胞、ウイルス、植物、食品等のSEM観察のためのサンプリング技術や観察テクニックについて詳細に解説します。

16:10-17:00 SEMの活用 (2) マテリアルサイエンス分野

ナノ粒子、ポリマー、薄膜、半導体試料等のSEM観察のためのサンプリング技術や観察テクニックについて詳細に解説します。

今年度のセミナーは、学んだ機器分析の知識をより実践の場で活用できるような内容になっています。初回は、多様な分野の研究・開発に必要な不可欠で中央分析センターでも利用者ニーズが高い走査電子顕微鏡です。

学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力をお願いします。

【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺 TEL092-802-2857
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp